

บทที่ 2

ระบบตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติ

ในระบบควบคุมทั่วไปนอกจากความจำเป็นที่จะควบคุมระบบให้ได้ผลผลิตตามต้องการแล้ว สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ ความปลอดภัย ในการทำงานปกติของระบบมีโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติขึ้นได้ทุกเมื่อ ความผิดพร่องดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน หรืออาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน อย่างไรก็ตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจนำมาซึ่งความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจทำให้โรงงานต้องหยุดงานเป็นเวลานาน เพื่อตรวจหาความผิดปกติ แล้วจึงเริ่มทำงานใหม่ ทำให้ต้องสูญเสียทั้งเวลา และผลผลิตที่ควรจะได้

ระบบตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความเสียหายดังกล่าวในการที่จะเตือนผู้ปฏิบัติงานเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจหาสาเหตุการเกิดความผิดปกติได้เร็วขึ้น ซึ่งช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น

ในบทนี้จะกล่าวครอบคลุมถึง คำจำกัดความและลักษณะของความผิดปกติ หลักการพิจารณาเลือกระบบตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติ รวมถึงหลักการเบื้องต้นและวิธีการตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติโดยทั่วไป

2.1 คำจำกัดความและลักษณะของความผิดปกติ

ความผิดปกติ (fault) หมายถึง ภาวะของกระบวนการที่ผลตอบของกระบวนการมีการเบี่ยงเบนไปจากจุดทำงานปกติ หรือผลผลิตที่ได้คลาดเคลื่อนไปจากที่ต้องการ อันเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธิ์ทางกายภาพ (physical coefficient) ของกระบวนการ

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบสามารถจำแนกตามลักษณะของการเปลี่ยนแปลงได้เป็น 2 แบบคือ

1. **ความผิดปกติเริ่มก่อ(incipient fault)** เป็นความผิดปกติที่เกิดจากการที่สัมประสิทธิ์ทางกายภาพของกระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ เช่น กรณีที่ใบแอสของอุปกรณ์วัดค่อยๆ เพิ่มขึ้น
2. **ความผิดปกติเฉียบพลัน(abrupt fault)** เป็นความผิดปกติที่เกิดจากการที่สัมประสิทธิ์ทางกายภาพของกระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน เช่น กรณีเกิดการลัดวงจร เป็นต้น

นอกจากจะจำแนกความผิดปกติตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงแล้ว สามารถจำแนกความผิดปกติตามผลการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อระบบ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น

1. **ความผิดปกติแบบทวีคูณ (multiplicative fault)** เป็นความผิดปกติที่เป็นผลทำให้พารามิเตอร์ของระบบมีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าปกติ สามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการสถานะได้

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= [A + \Delta A]x(t) + [B + \Delta B]u(t) \\ y(t) &= [C + \Delta C]x(t)\end{aligned}\tag{2.1}$$

เมื่อ x	เป็นเวกเตอร์ตัวแปรสถานะขนาด $n \times 1$
u	เป็นเวกเตอร์สัญญาณเข้าขนาด $m \times 1$
y	เป็นเวกเตอร์สัญญาณออกขนาด $k \times 1$
A	เป็นเมตริกซ์ขนาด $n \times n$
B	เป็นเมตริกซ์ขนาด $n \times m$
C	เป็นเมตริกซ์ขนาด $k \times n$

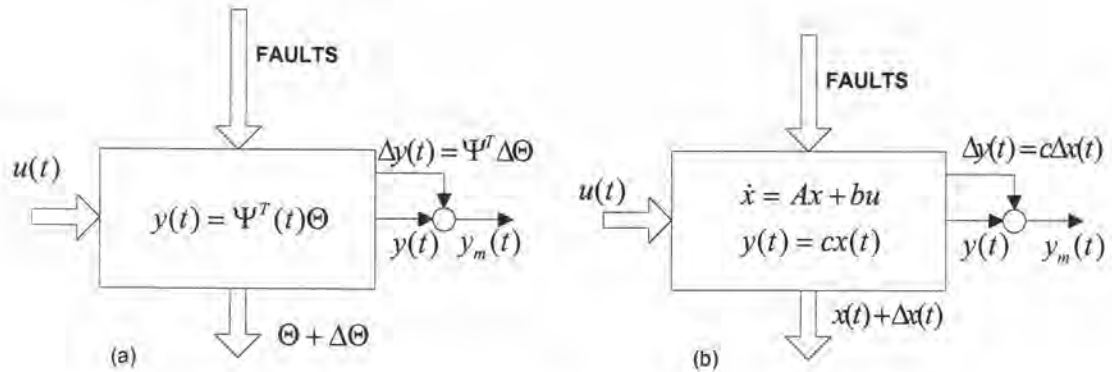
$\Delta A, \Delta B, \Delta C$ เป็นส่วนที่เบี่ยงเบนไปของเมตริกซ์ A, B, C ตามลำดับ

ตัวอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานในวงจรอันเนื่องมาจากการอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง

2. **ความผิดปกติแบบเพิ่มพูน (additive fault)** เป็นความผิดปกติที่เป็นผลทำให้ตัวแปรสถานะมีการเปลี่ยนแปลง หรือเบี่ยงเบนไปจากค่าปกติ สามารถเขียนในรูปของสมการสถานะได้

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= A[x(t) + \Delta x(t)] + Bu(t) \\ y(t) &= C[x(t) + \Delta x(t)]\end{aligned}\quad (2.2)$$

เมื่อ Δx เป็นตัวแปรสถานะที่เบี่ยงเบนไป
ตัวอย่าง เช่น เกิดการรั่วของถังน้ำ



รูปที่ 2.1 รูปแบบความผิดพลาดในกระบวนการ :

(a) ความผิดพลาดแบบพารามิเตอร์ ; (b) ความผิดพลาดแบบเพิ่มพูน

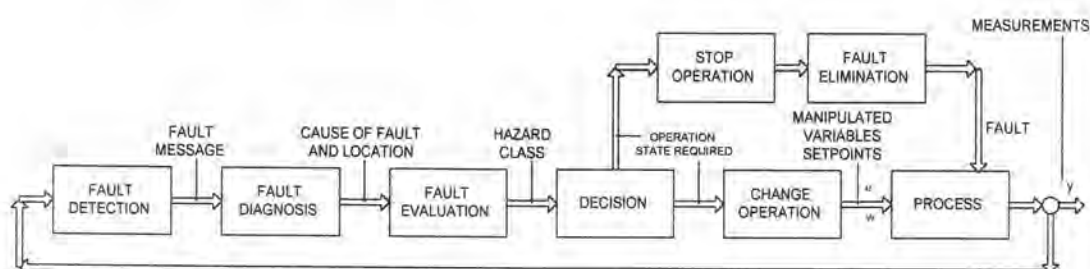
ความผิดพลาดอาจแยกได้ตามตำแหน่งของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบได้ ดังนี้คือ

- **ความผิดพลาดในกระบวนการ** : เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เช่น ถังรั่ว หรือค่าสัมประสิทธิ์บางตัวของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
- **ความผิดพลาดในตัวตรวจรู้ (sensor)** : เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในตัวตรวจรู้หรือในอุปกรณ์วัด เช่น มีไบแอสในอุปกรณ์วัด
- **ความผิดพลาดในตัวขับเคลื่อน (actuator)** : เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในตัวขับเคลื่อน ทำให้สัญญาณออกของตัวขับเคลื่อนผิดไปจากที่ต้องการ
- **ความผิดพลาดในตัวควบคุม** : เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในตัวควบคุม ทำให้สัญญาณควบคุมผิดไปจากที่ต้องการ

2.2 ส่วนประกอบในการสอดส่องระบบ [1]

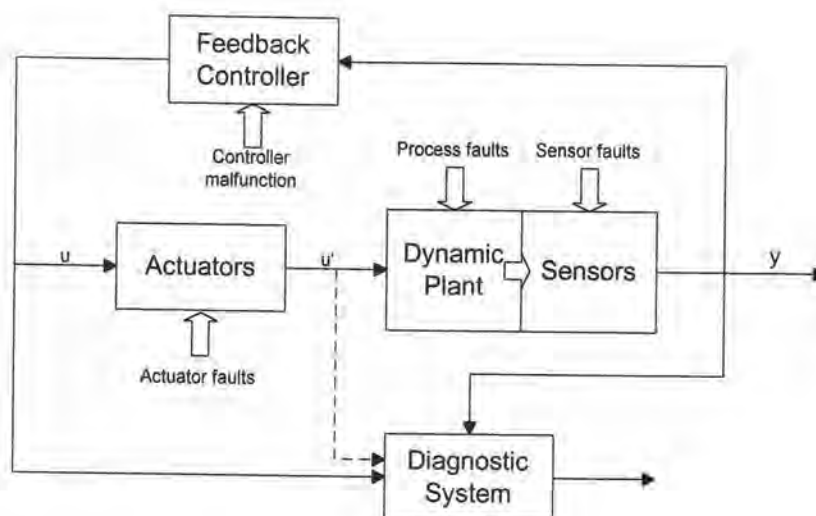
ในระบบควบคุมอัตโนมัติทั่วไป นอกจากจะมีการควบคุมระบบขั้นแรก (first level) ซึ่งได้แก่ การควบคุมแบบต่าง ๆ เช่น การควบคุมแบบป้อนกลับ ยังจำเป็นต้องมีการควบคุมในขั้นที่สอง (second level) ที่คอยสอดส่องระบบ ดังแสดงในรูปที่ 2.2 เพื่อให้ได้ระบบที่มีความปลอดภัย และได้ผลผลิตตามต้องการ ส่วนประกอบของการสอดส่องระบบสำหรับความผิดปกติอาจแบ่งได้เป็น

- การตรวจพบความผิดปกติ (fault detection) : ทำหน้าที่สอดส่อง ตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้น
- การวินิจฉัยความผิดปกติ (fault diagnosis) : ทำหน้าที่หาตำแหน่ง และสาเหตุของความผิดปกติ
- การประเมินความผิดปกติ (fault evaluation) : ทำหน้าที่ประเมินความร้ายแรงของความผิดปกติ
- การตัดสินใจ (decision) : ทำหน้าที่ตัดสินใจแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้น



รูปที่ 2.2 วงจรการสอดส่องระบบสำหรับความผิดปกติ

สำหรับระบบตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติเป็นส่วนหนึ่งของการสอดส่องระบบ ซึ่งมีโครงสร้างทั่วไปดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 โครงสร้างทั่วไปของระบบตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติ

2.3 หลักในการพิจารณาการตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติ[18]

ในการพิจารณาเลือกใช้ระบบตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติ จำเป็นต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระบบ ซึ่งปกติมักจะคำนึงถึง

1. ความเร็วในการตรวจพบ

ระบบตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติที่ดีควรตรวจพบเหตุการณ์ผิดปกติ และหาสาเหตุได้รวดเร็วก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากขึ้น

2. ความไวต่อความผิดปกติเริ่มก่อ

ระบบตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติจำเป็นต้องคำนึงความไวในการตรวจพบความผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดปกติเริ่มก่อ แต่อย่างไรก็ตามความไวของระบบมักจะมีคุณสมบัติแย้งกันกับความคงทนของระบบต่อความไม่แน่นอนของแบบจำลอง และสัญญาณรบกวน

3. อัตราการเตือนผิด

หมายถึง โอกาสที่ระบบจะเตือนว่าเกิดความผิดปกติขึ้นในขณะที่ระบบทำงานปกติ อัตราการเตือนผิดจะมีผลต่อความเชื่อถือของระบบตรวจพบและวินิจฉัย ระบบตรวจพบและวินิจฉัยที่มีอัตราการเตือนผิดสูงจะทำให้กระบวนการต้องหยุดทำงานบ่อยโดยไม่จำเป็น ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ดังนั้นระบบตรวจพบและวินิจฉัยที่ดีควรมีอัตราการเตือนผิดต่ำ

4. กรณีไม่สามารถตรวจพบความผิดพลาด

หมายถึง การที่เกิดความผิดพลาดขึ้นในระบบ แต่ระบบตรวจพบและวินิจฉัยไม่สามารถตรวจพบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหาย ระบบตรวจพบและวินิจฉัยที่ดีควรตรวจพบได้ทุกครั้งที่เกิดความผิดพลาด

5. การบอกตำแหน่ง และสาเหตุของความผิดพลาด

หมายถึง กรณีที่ระบบหาจุดที่เกิด และสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง ระบบตรวจพบและวินิจฉัยควรมีความแม่นยำสูงในการบอกถึงสาเหตุของความผิดพลาด เพื่อที่จะแก้ไขได้ถูกต้อง

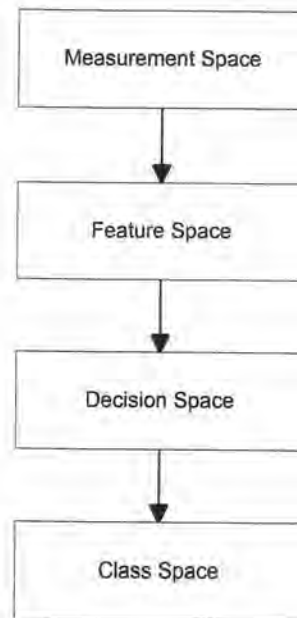
2.4 วิธีการตรวจพบและวินิจฉัยความผิดพลาด

ระบบตรวจพบและวินิจฉัยความผิดพลาดแบบดั้งเดิม มักจะใช้ฮาร์ดแวร์ในการตรวจหาความผิดพลาด โดยอาจใช้อุปกรณ์วัดพิเศษสำหรับวัดตัวแปรบางตัวในระบบ วิธีดังกล่าวสิ้นเปลืองและใช้พื้นที่ในการวางอุปกรณ์วัดจำนวนมาก และยากที่จะพิจารณาเลือกจุดที่จะวัด อีกทั้งตัวแปรที่ต้องการวัดบางตัวไม่สามารถหาอุปกรณ์วัดมาวัดได้

เนื่องจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีความสามารถสูงขึ้น งานวิจัยส่วนมากจึงมักจะใช้วิธีการวิเคราะห์ซึ่งใช้อุปกรณ์วัดน้อยกว่าวิธีทางฮาร์ดแวร์ อาศัยเพียงการประมวลผลข้อมูลที่วัดมาได้ โดยทั่วไปแล้วหลักการพื้นฐานของระบบตรวจพบและวินิจฉัยความผิดพลาดอาจมองได้ว่าเป็นการตัดสินใจว่าเกิดความผิดพลาดใดขึ้นในระบบจากข้อมูลที่สามารวัดได้จากระบบ ซึ่งสามารถแยกเป็นขั้นตอนในการแปลงข้อมูลอย่างคร่าว ๆ ได้ดังรูปที่ 2.4 โดยแยกเป็นปริภูมิดังนี้

1. **ปริภูมิการวัด(Measurement space)** : เป็นปริภูมิของค่าที่สามารถวัดได้จากระบบ x_1, x_2, \dots, x_n ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของค่าที่วัดได้เหล่านี้
2. **ปริภูมิลักษณะสำคัญ (Feature space)** : เป็นปริภูมิของจุด $y = [y_1, y_2, \dots, y_l]$ เมื่อ y_i เป็นลักษณะสำคัญที่ i ซึ่งเป็นฟังก์ชันของค่าที่วัดได้โดยอาศัยความรู้ที่ในปัญหาที่มีอยู่ ความรู้ดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ของสัญญาณเข้าและสัญญาณออก เช่น สมดุลของสาร และสมดุลของพลังงานในกระบวนการ โดยทั่วไปแล้วการแปลงจาก ปริภูมิการวัด ไปยังปริภูมิลักษณะสำคัญจะช่วยให้แบ่งคลัสเตอร์(cluster) ได้ดี ทำให้มีพื้นผิวในการตัดสินใจ (decision surfaces) ที่ง่ายในการแบ่ง

3. **ปริภูมิการตัดสินใจ (Decision space)** : เป็นปริภูมิของจุด $z = [z_1, z_2, \dots, z_m]$ เมื่อ m คือจำนวนชนิดของความผิดพลาดที่รู้จัก ปริภูมิการตัดสินใจได้จากการแปลงที่เหมาะสมจากปริภูมิลักษณะสำคัญ
4. **ปริภูมิกลุ่ม (Class space)** : เป็นเซตของจำนวนเต็มที่แสดงถึงชนิดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น กล่าวคือเป็นการชี้ว่าจากค่าที่วัดได้เป็นความผิดพลาดชนิดใด



รูปที่ 2.4 การแปลงข้อมูลสำหรับการตรวจพบและวินิจฉัยความผิดพลาด

อย่างไรก็ตามวิธีใช้การวิเคราะห์ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของความคงทนต่อความไม่แน่นอนของแบบจำลอง และสัญญาณรบกวน วิธีใช้การวิเคราะห์สามารถแยกได้เป็น 2 แบบ คือ

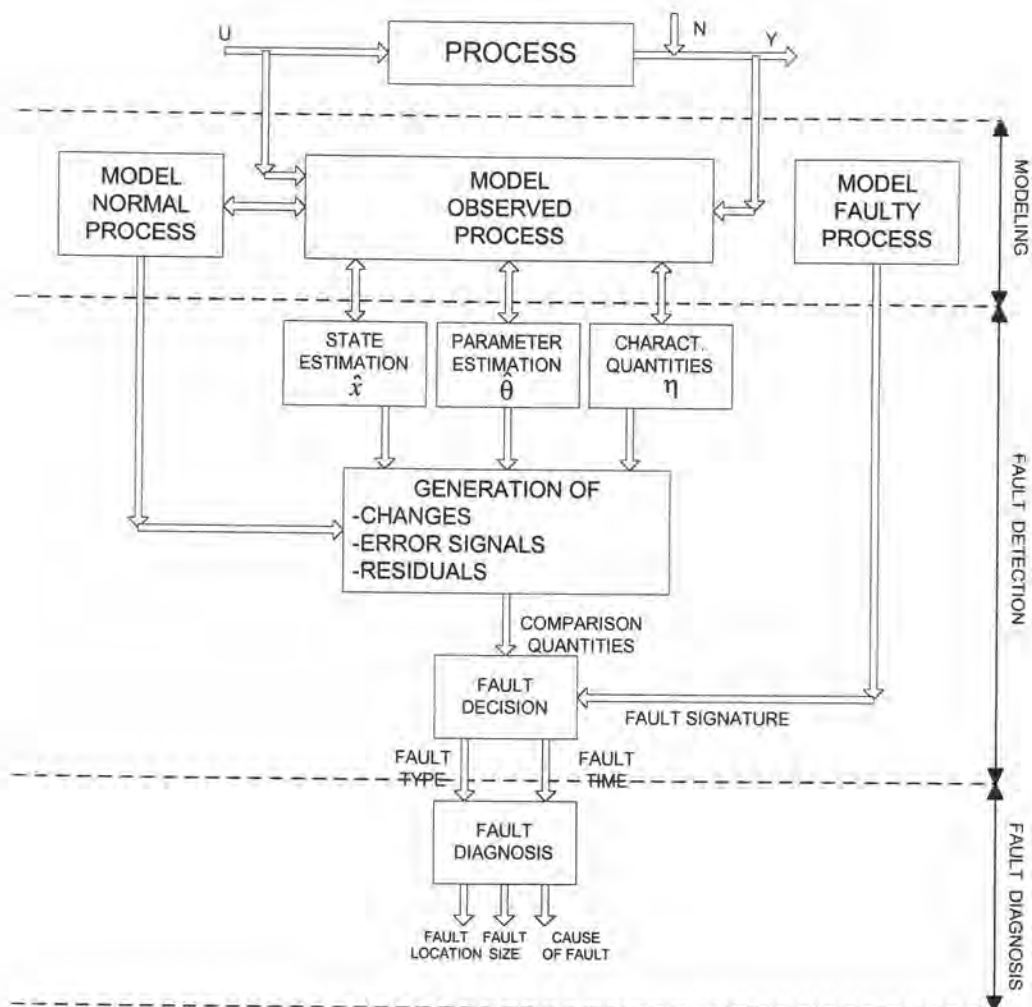
1. ระบบตรวจพบและวินิจฉัยความผิดพลาดโดยใช้แบบจำลอง (model - based fault detection and diagnosis)
2. ระบบตรวจพบและวินิจฉัยความผิดพลาดโดยไม่ใช้แบบจำลอง (model - free fault detection and diagnosis)

2.4.1 ระบบตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติโดยใช้แบบจำลอง

ระบบตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติที่ใช้แบบจำลองมีโครงสร้างทั่วไปดังรูปที่ 2.5 จากโครงสร้างดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ

1. การจำลองระบบ ในส่วนนี้เปรียบเสมือนความรู้และประสบการณ์ที่มีต่อระบบซึ่งประกอบด้วย

- แบบจำลองของระบบในสภาวะปกติ
- แบบจำลองของระบบที่สังเกตได้
- แบบจำลองของระบบในสภาวะเกิดความผิดปกติ



รูปที่ 2.5 โครงสร้างทั่วไปของการตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติโดยใช้แบบจำลอง

2. การตรวจพบความผิดปกติ : ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่คอยตรวจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งประกอบด้วย

- การประมาณตัวแปรสถานะ (state estimation)
- การประมาณพารามิเตอร์ (parameter estimation)
- การประมาณปริมาณของลักษณะสมบัติต่าง ๆ (Characteristic quantities)

ค่าที่ได้จากการประมาณจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับค่าจากแบบจำลองในสภาวะปกติ เพื่อสร้างส่วนตกค้างขึ้นมา จากส่วนตกค้างที่เกิดขึ้นก็จะถูกนำไปพิจารณาตัดสินว่าเกิดความผิดปกติหรือไม่

3. การวินิจฉัยความผิดปกติ : ในส่วนนี้จะทำหน้าที่วิเคราะห์หาสาเหตุ และตำแหน่งที่เกิดความผิดปกติ ซึ่งอาจใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ได้

แม้วิธีที่ใช้แบบจำลองสามารถใช้วิธีการประมาณตัวแปรสถานะ หรือประมาณพารามิเตอร์แบบต่าง ๆ ได้เช่น วิธีกำลังสองน้อยสุดแบบเวียนเกิด (recursive least square) ตัวกรองเอ็กเทนเดด-คาลมาน (extended Kalman filter) แต่วิธีนี้ยากที่จะทำไปใช้กับระบบที่ซับซ้อน, ระบบที่มีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในแบบจำลอง

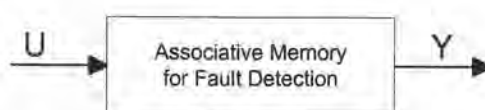
2.4.2 ระบบตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติโดยไม่ใช้แบบจำลอง

ระบบตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติที่ไม่ใช้แบบจำลอง จะอาศัยความรู้ที่มีเกี่ยวกับระบบ หรือชุดข้อมูลที่เป็นตัวเลขของตัวแปรที่วัดได้ในระบบกับสถานะของระบบมาสร้างความสัมพันธ์ และทำการวิเคราะห์ วิธีนี้สามารถแยกได้เป็น 2 พวก คือ

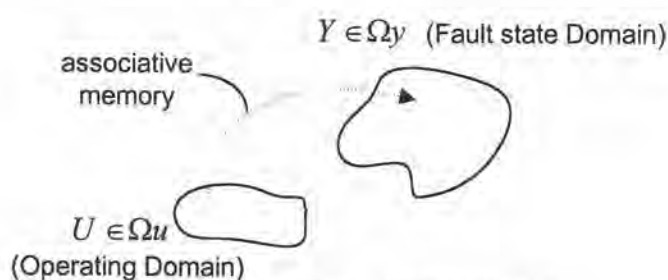
1. ระบบฐานกฎผู้เชี่ยวชาญ (Rule-based expert system) : วิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจพบและวินิจฉัยความผิดปกติ โดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการ สร้างฐานความรู้ขึ้นมาในรูปประโยค "if - then" ดังนั้นจึงอาจนำตรรกศาสตร์ฟัซซี่ มาใช้ได้โดยทำให้อยู่ในรูปของแบบจำลองฟัซซี่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากวิธีนี้ต้องอาศัยความเข้าใจระบบอย่างมาก ทำให้ยากในการที่จะนำไปใช้กับระบบที่มีความซับซ้อน

2. การส่งรูปแบบ (pattern mapping) : วิธีนี้จะใช้วิธีการรู้จำแบบหรือใช้ข่ายงานประสาทในการส่ง (map) ค่าที่ได้จากการวัดในปริภูมิเวกเตอร์สัญญาณเข้า, $U = [u_1, \dots, u_r]^T$ ไปยัง ปริภูมิเวกเตอร์สัญญาณออกซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2.6 โดยผ่านการเรียนรู้จากชุดข้อมูลของเวกเตอร์สัญญาณเข้า-ออกของระบบ แต่เนื่องจากวิธีนี้เป็น ฐานความรู้แบบไม่เป็นโครงสร้าง ทำให้ยากที่จะทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัว กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

จากจุดเด่นของวิธีใช้ฐานกฎที่เป็นฐานความรู้แบบเป็นโครงสร้าง และจุดเด่นของวิธีการส่งรูปแบบที่สามารถเรียนรู้ได้จากชุดข้อมูล จึงได้มีความพยายามเอาจุดเด่นของทั้งสองวิธีมารวมกัน เช่น อยู่ในรูปของระบบนิวรอล-ฟัซซี่(neural - fuzzy system) [20]



(a) Block Diagram



(b) Pattern mapping from operating to fault related output

รูปที่ 2.6 ภาพทางเรขาคณิตของการตรวจพบที่ใช้การส่งผ่านรูปแบบ

สำหรับงานวิทยานิพนธ์นี้ เป็นการศึกษาวิธีการตรวจพบและวินิจฉัยความผิดพลาดตามแนวทางของ M.M. Polycapou และ A.J. Helmicki ซึ่งเป็นวิธีที่จัดอยู่ในวิธีที่ใช้แบบจำลอง โดยมีการปรับปรุงในส่วนของการวินิจฉัยความผิดพลาด ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 3 ต่อไป